

# Microscopie à Force Atomique Spécialité « Transition de phase »

## Objectif - Compétences acquises :

A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de : • Comprendre la théorie relative à la microscopie à force atomique couplée à la mesure de transition de phase (nanoTATM, Anasys Instruments) • Utiliser le microscope AFM nanoIR (Anasys Instruments) • Réaliser et analyser des mesures de transition de phase locale sur les matériaux polymères ou organiques à partir du microscope nanoTA

## Public concerné :

- Académique
- Industriel

## Durée :

- 1 jours

## Date/lieux :

- Nous consulter
- Non défini

## Equipe pédagogique :

- Spécialiste du domaine

## Approche pédagogique :

- Alternance de cours et de travaux pratiques

## Renseignement pédagogique :

- Agnus Guillaume
- guillaume.agnus@u-psud.fr

## Frais de participation individuels :

- 1200 € HT

## Renseignements et inscriptions :

- Inscription : Service de Formation Continue de PARIS SUD
- Tél : +33(0)
- Fax : +33(0)
- Email : formation.continue@u-psud.fr
- Date limite d'inscription : 1 mois avant

## Nombre de places limitées :

- Min/Max : 2 à 4 personnes

## Prérequis :

- Connaissance de l'AFM standard ou formation AFM standard déjà validée

## Compétences acquises :

- Comprendre la théorie relative à la microscopie à force atomique couplée à la mesure de transition de phase (nanoTATM, Anasys Instruments) • Utiliser le microscope AFM nanoIR (Anasys Instruments) • Réaliser et analyser des mesures de transition de phase locale sur les matériaux polymères ou organiques à partir du microscope nanoTA

## Programme :

- Matin (3h) : Théorie mesures de transition et travaux pratiques pour la calibration du microscope
- Après-midi (4h) : Travaux pratiques : analyse des différents polymères

**Validation :**

Cette formation constitue une action d'adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de participation. Une évaluation de fin de formation permet de mesurer la satisfaction des stagiaires, notamment concernant l'atteinte des objectifs pédagogiques.